

# VIII Международная научно-практическая конференция «Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине» Секция 5. Радиационные и пучково-плазменные технологии в науке, технике и медицине

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОГЛОЩАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА УСКОРИТЕЛЯ

<u>Н.Н. Курапов</u>, И.В. Шориков, С.М. Придчин, Я.В. Бодряшкин, А.С. Черкасов, А.И. Малыгин, А.М. Опекунов Федеральное государственное унитарное предприятие Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики

ФГУП ‹‹РФЯЦ-ВНИИЭФ››

Россия, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, 37, 607190

E-mail: <u>kurapov@expd.vniief.ru</u>

Разработана система, позволяющая осуществлять оперативный контроль энергетического спектра ускоренных электронов методом поглощающих фильтров.

Работа включала в себя разработку и изготовление измерительной сборки, численное моделирование измерительной сборки, разработку и изготовление технических средств автоматизированного контроля распределения поглощенных зарядов в наборе алюминиевых пластин измерительной сборки, разработку управляющей программы для контроля распределения поглощенных зарядов в измерительной сборке, испытание системы регистрации на ускорителе электронов ЛУ-10-20.

Измерительная сборка представляет собой набор из двадцати алюминиевых пластин размером 100х100 мм и толщиной 1 мм. Все пластины изолированы между собой и имеют возможность контроля поглощенного заряда. Сборка имеет возможность измерения энергии пучка электронов от 1 до 10 МэВ и работает при средних токах электронного пучка до 150 мкА.

Испытания разработанного образца системы регистрации подтвердили правильность схемных решений и возможность использования расчетной модели для оперативного контроля энергии электронного пучка в режиме реального времени.

В разработанной системе предусмотрена возможность модернизации, в результате которой контроль энергетического спектра можно будет осуществлять в режиме реального времени.

## ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ 65Г ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ВОЛЬФРАМОМ И ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ

М.А. Сексеналина, О.С. Толкачев, Ю.Ф. Иванов

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050

E-mail: malika.seksenalina@mail.ru

Упрочнение конструкционных сталей является актуальным направлением современного материаловедения. Наиболее перспективный метод модификации поверхностных слоев металлов состоит в применении комбинированных технологий, сочетающих поверхностное легирование и последующее термическое воздействие с использованием концентрированных потоков энергии [1].

Целью работы являлось исследование структуры и свойств поверхностного слоя стали 65Г после комбинированной обработки, заключающейся в электроискровом легировании вольфрамом и последующем облучении интенсивным электронным пучком на установке «СОЛО» (параметры пучка электронов: 16 кэВ, 50 Дж/см², 200 мкс, 0,3 с-1, 30 имп.). Исследование структуры модифицированной поверхности осуществляли методами рентгенофазового анализа (прибор Shimadzu XRD-7000S) и сканирующей электронной микроскопии (прибор JSM-7500F JEOL); свойства модифицированного поверхностного слоя стали характеризовали величиной твердости (прибор Shimadzu DUH-211S) и износостойкости (прибор Tribotechnic).



## VIII Международная научно-практическая конференция «Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине» Секция 5. Радиационные и пучково-плазменные технологии в науке, технике и

Секция 5. Радиационные и пучково-плазменные технологии в науке, технике и медицине

В результате выполненных испытаний выявлено увеличение (относительно объема образца) микротвердости поверхностного слоя стали, легированной вольфрамом, в  $\approx 1,9$ . Установлено, что износостойкость поверхности стали, легированной вольфрамом, увеличивается в  $\approx 90$  раз.

Выполнены исследования структуры и фазового состава модифицированного слоя стали 65Г, легированной вольфрамом. Установлено, что увеличение твердости и износостойкости поверхностного слоя стали 65Г, легированной вольфрамом и дополнительно облученной интенсивным электронным пучком, обусловлено растворением пленки вольфрама в поверхностном слое стали с последующим формированием многофазной субмикро- и нанокристаллической закалочной структуры (рис. 1).

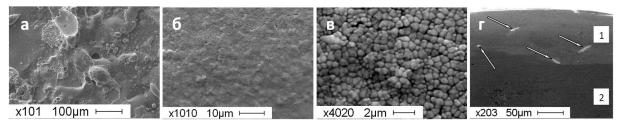


Рисунок .1. Структура поверхности стали 65Г после электроискрового легирования вольфрамом (a) и последующего облучения электронным пучком (б, в); г – структура поперечного шлифа стали 65Г, легированной вольфрамом и облученной электронным пучком, стрелками указаны частицы вольфрама; 1 – слой легирования, 2 – объем стали 65Г.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грибков В.А., Григорьев Ф.И., Калин Б.А., Якушин В.Л. Перспективные радиационно-пучковые технологии обработки материалов. – М.: Круглый стол, 2001. - 528 с.

### ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЫ ПО ПЕРЕХОДНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

М.В. Сергеев, К.А. Алишина, А.П.Потылицын

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Россия, г.Томск, пр. Ленина, 30, 634050

E-mail: <a href="mailto:sanjer.sergeev@yandex.ru">sanjer.sergeev@yandex.ru</a>

Как показано в работе [1], характеристики переходного излучения (ПИ) зависят не только от энергии налетающей заряженной частицы, но и от характеристик мишени, и от угла падения частицы на мишень

В работе [2] было предложено использовать оптическое ПИ нерелятивистских электронов для исследования характеристик многослойной мишени, однако из-за низкой энергии электронов и высокого многократного рассеяния характеристики переходного излучения будут искажаться. При использовании умеренно релятивистских электронов (с энергией в несколько МэВ) степень искажения будет существенно меньше.

В работах [3,4] исследовались характеристики ПИ от реальных мишеней (напр. алюминий) в отличие от модели идеально проводящей мишени [1]. В частности, использовался пучок с энергией 1.9 МэВ для угла падения пучка на мишень падения не более 45°. По мере увеличения угла падения (скользящее падение) угловые распределения оптического переходного излучения будут определяться не только кинематикой процесса, но и оптическими характеристиками мишени (n — коэффициент преломления и k - коэффициент поглощения).